

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
 ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

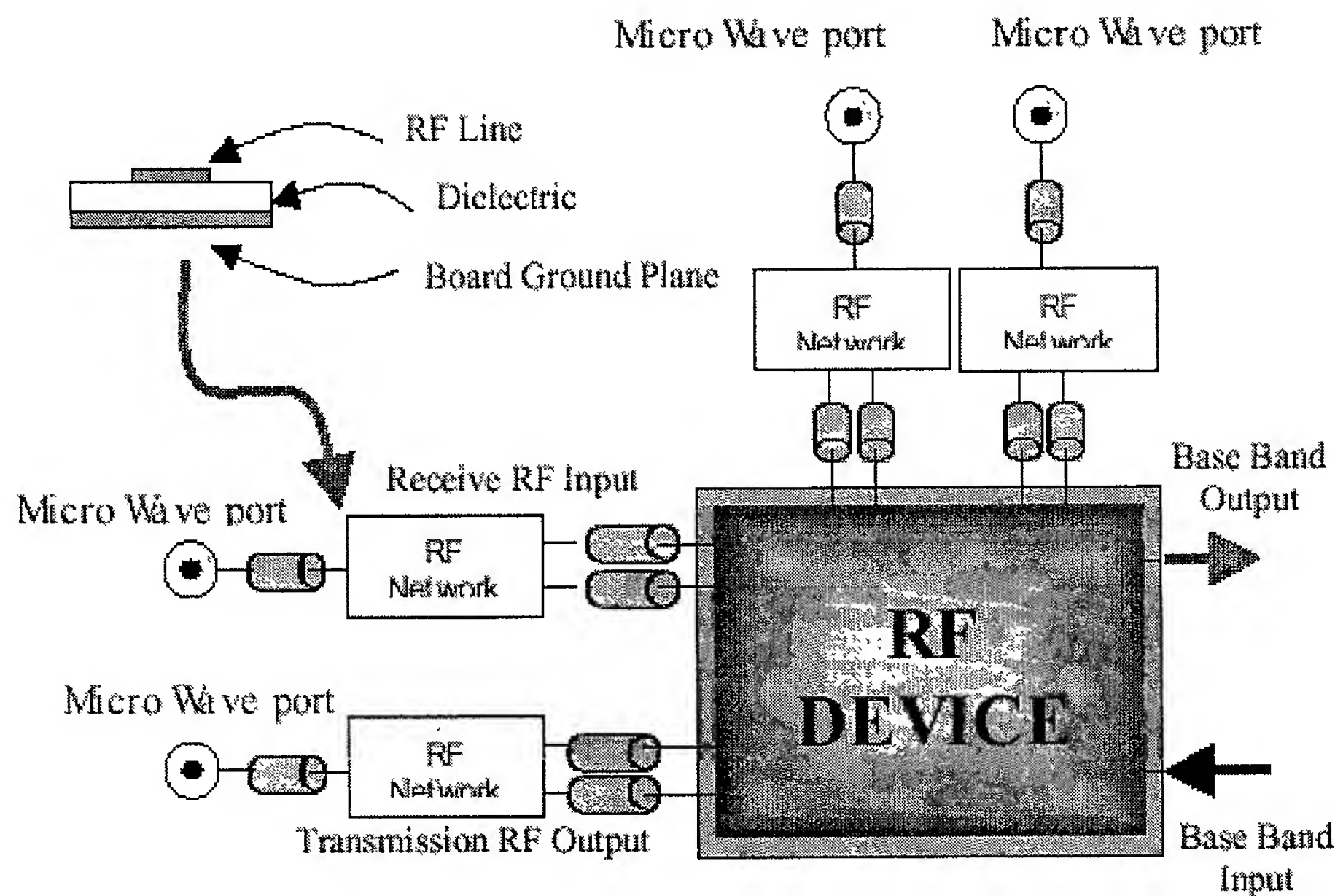


FIG. 1

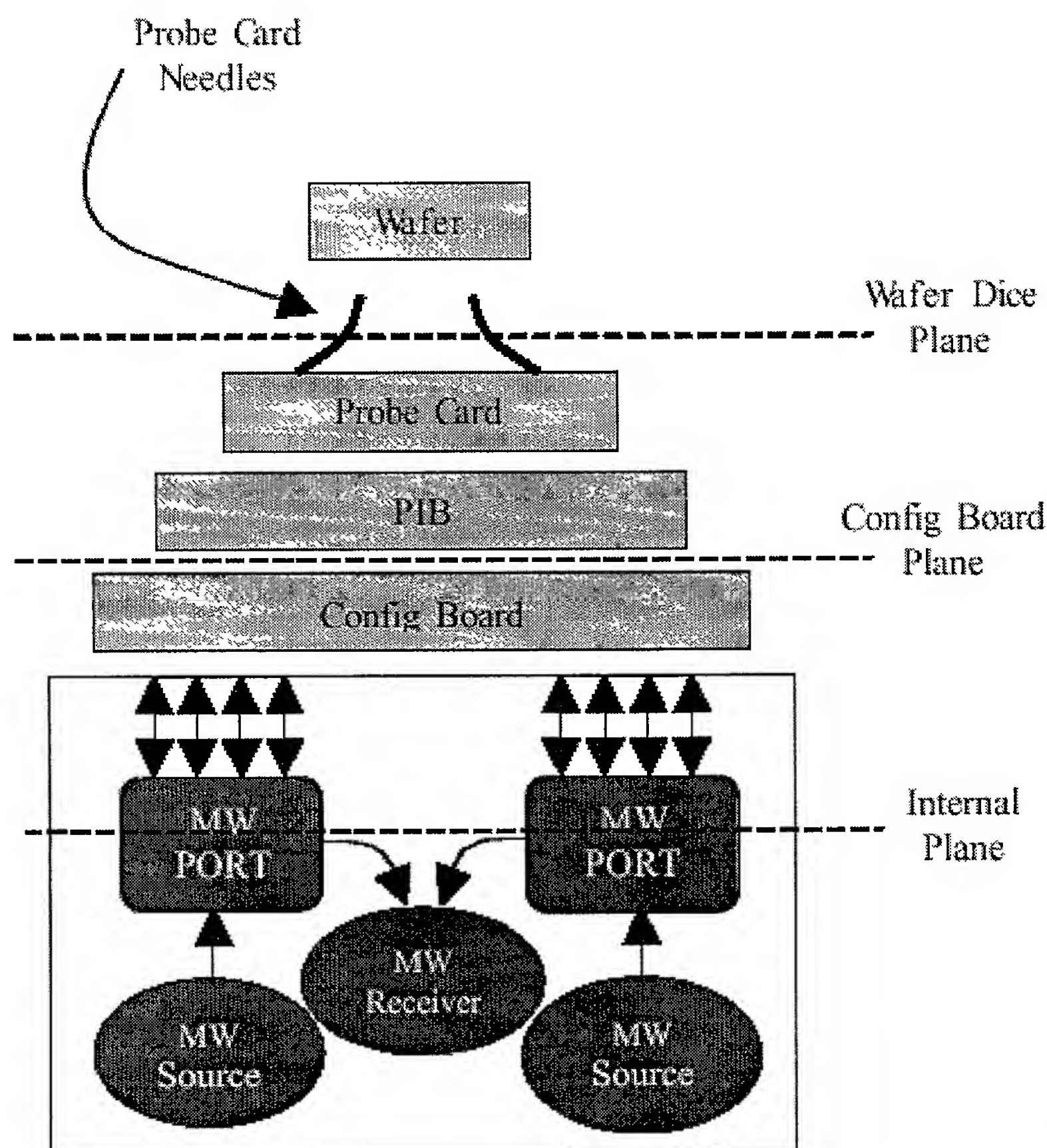


FIG. 2

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
 ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

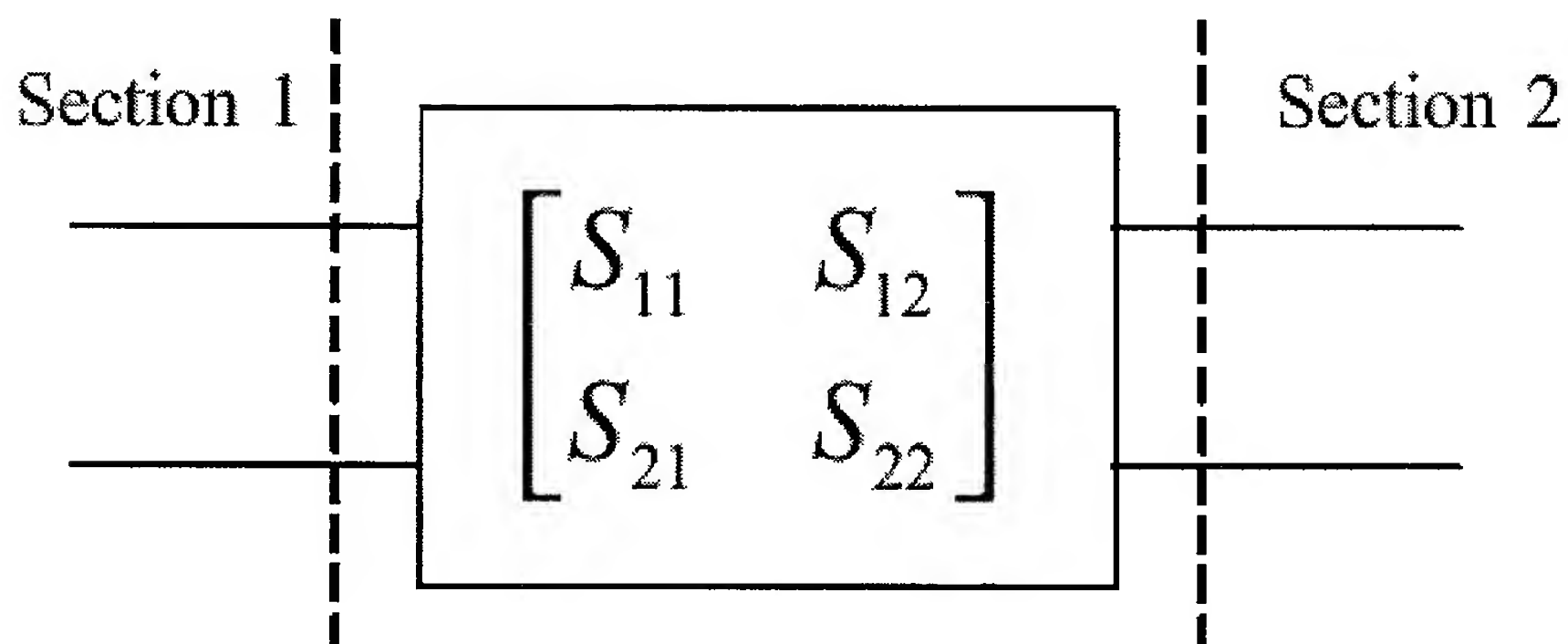


FIG. 3

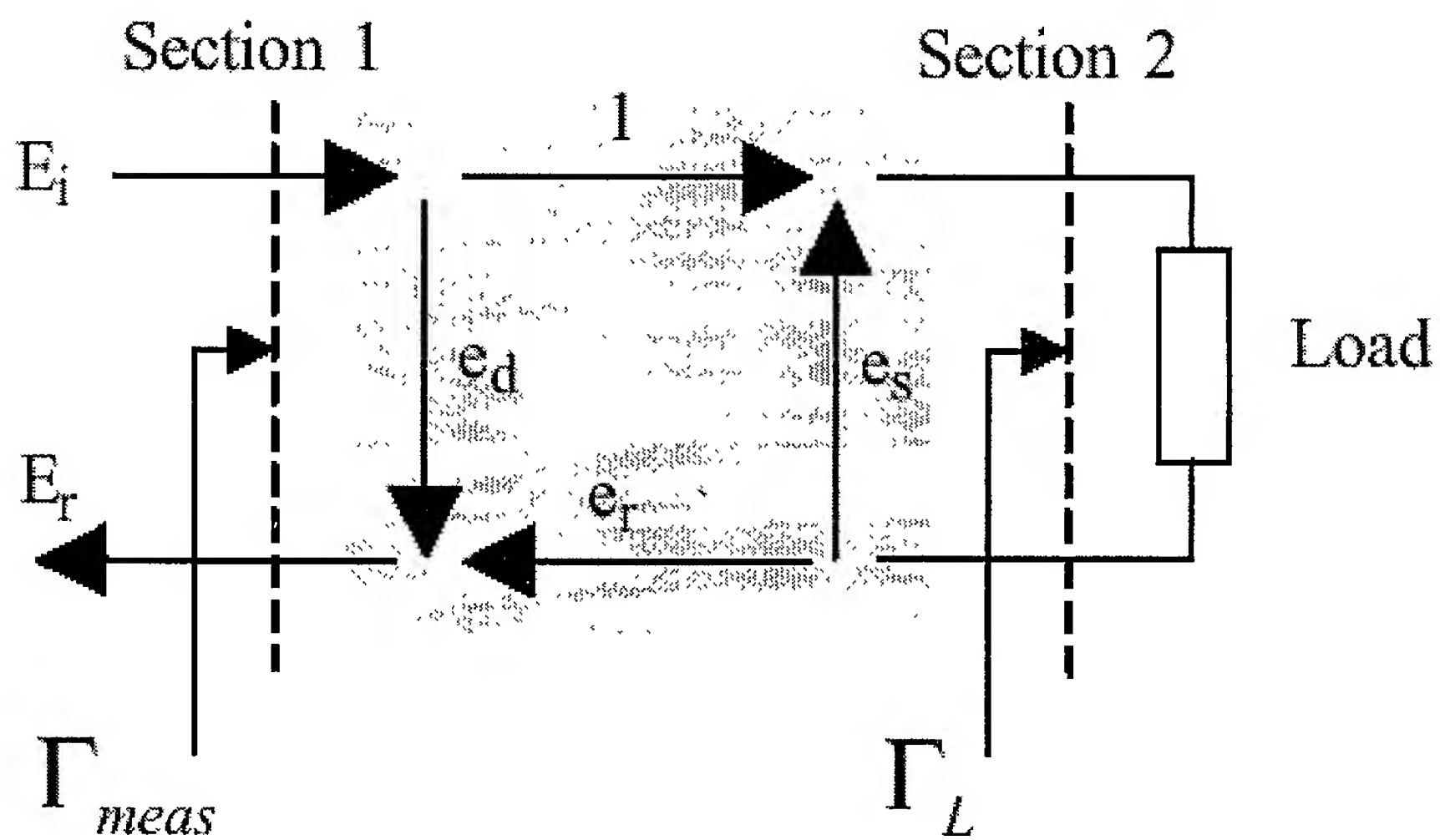
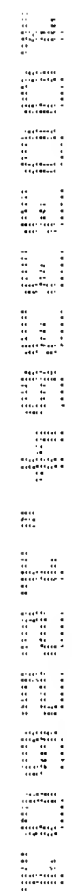


FIG. 4

[illegible]

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

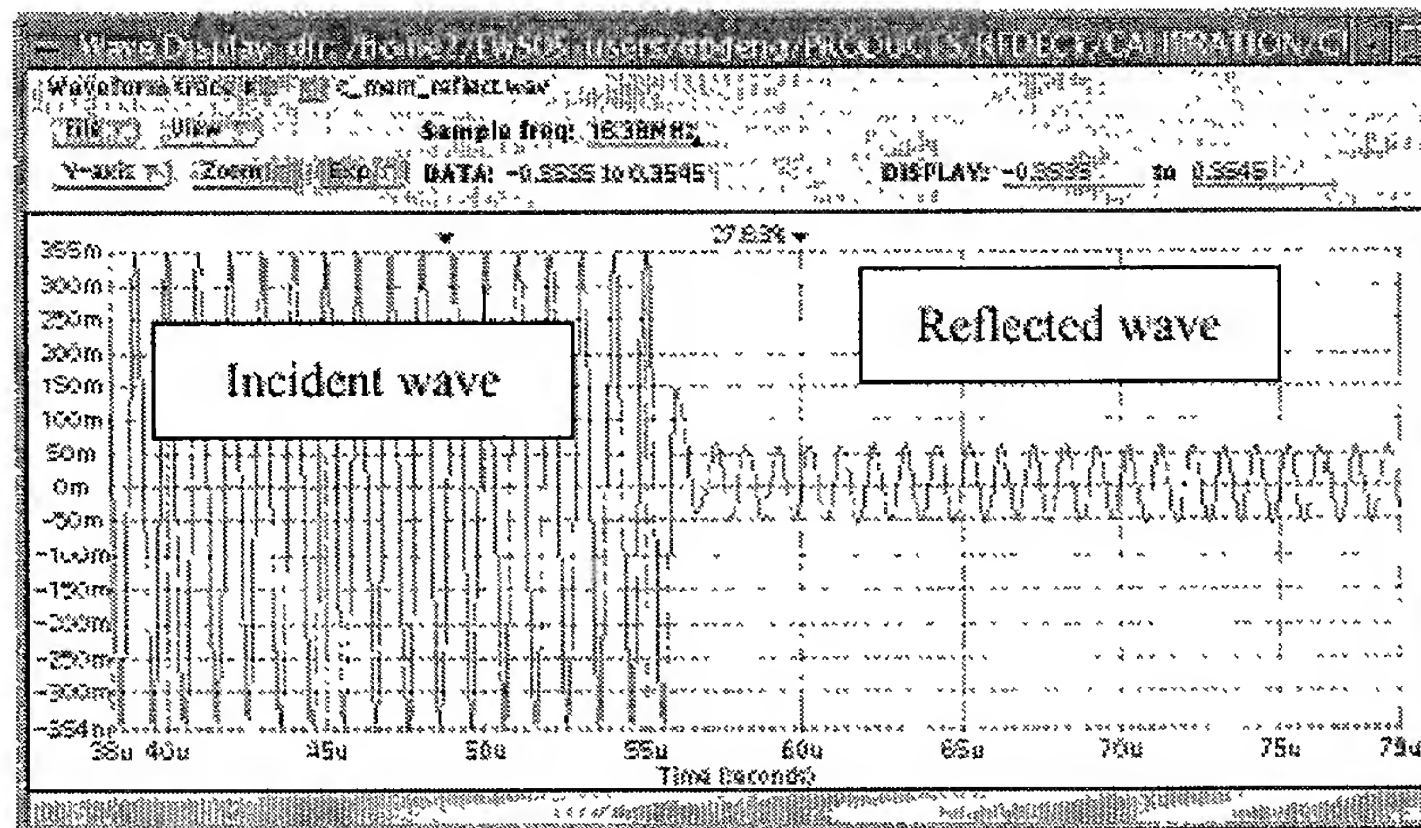


FIG. 6

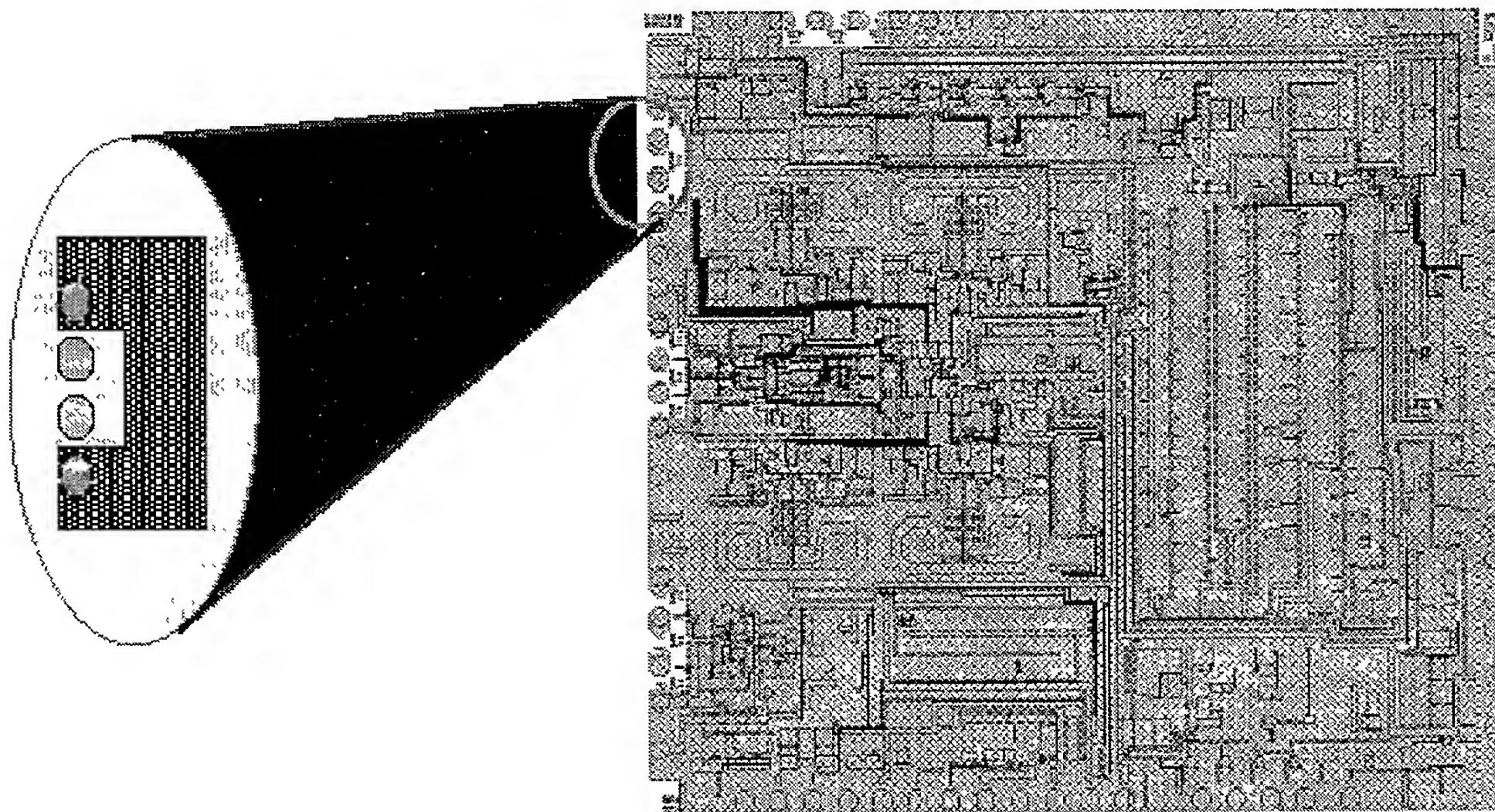


FIG. 7

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

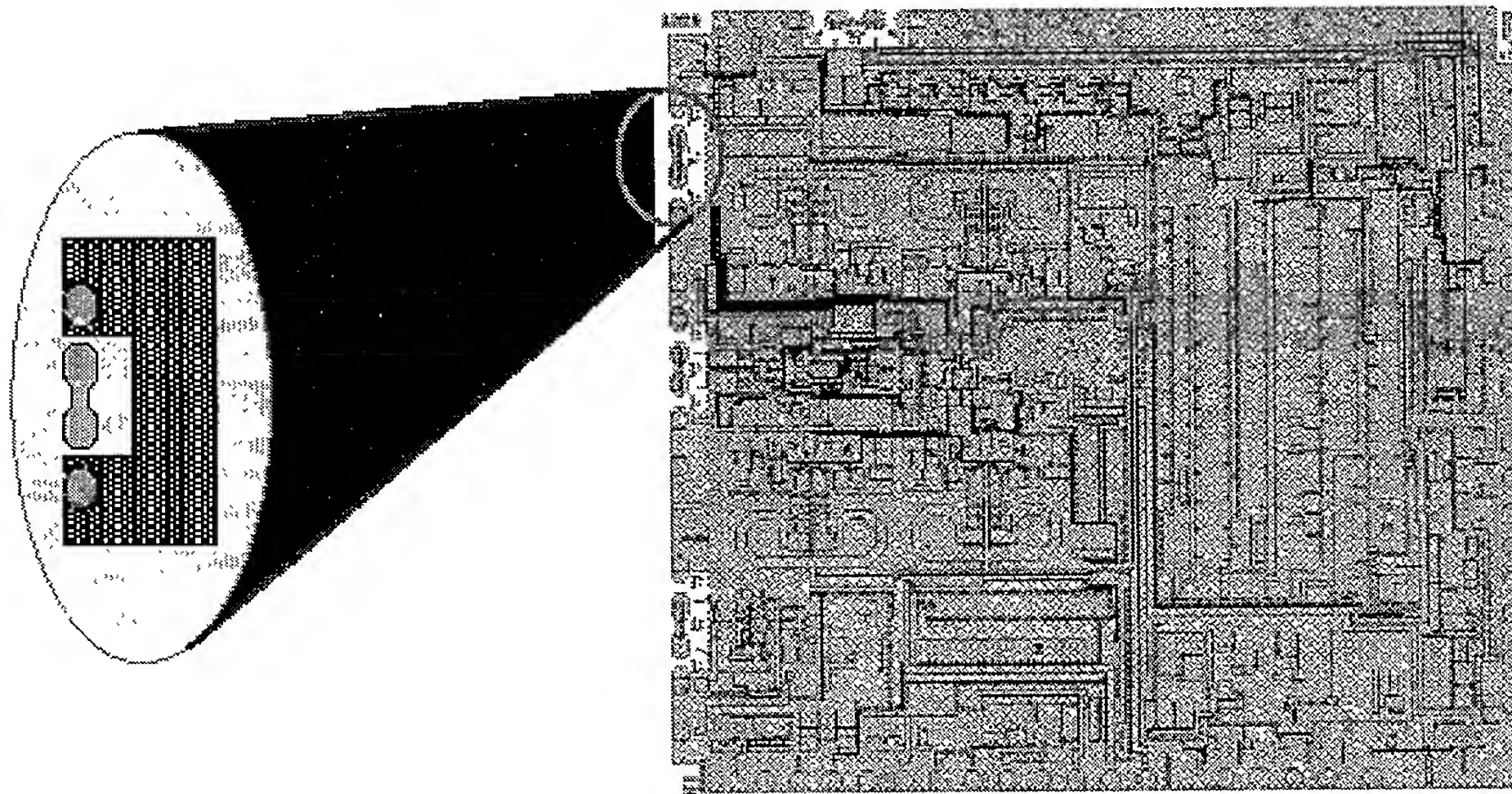


FIG. 8

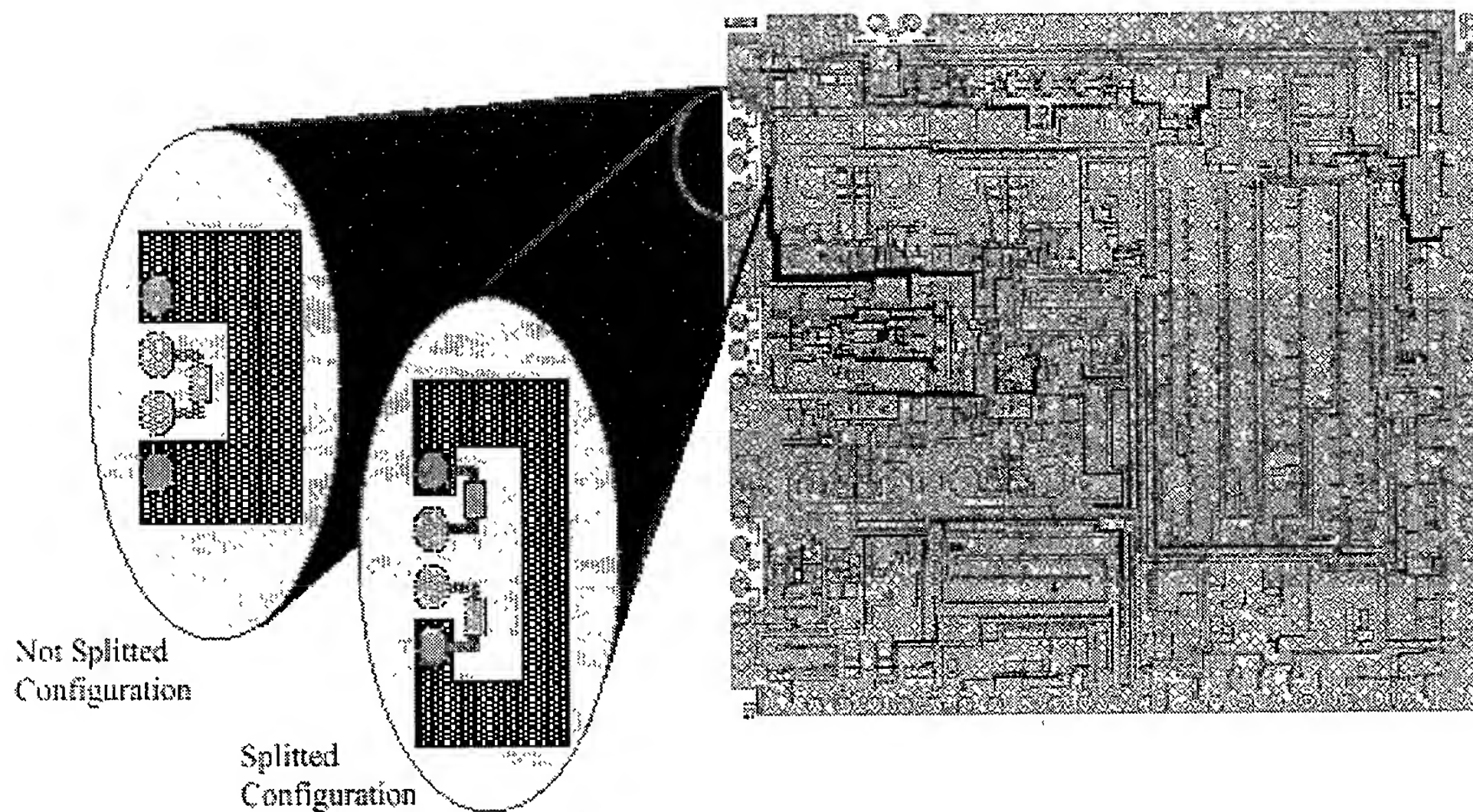


FIG. 9

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
 ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

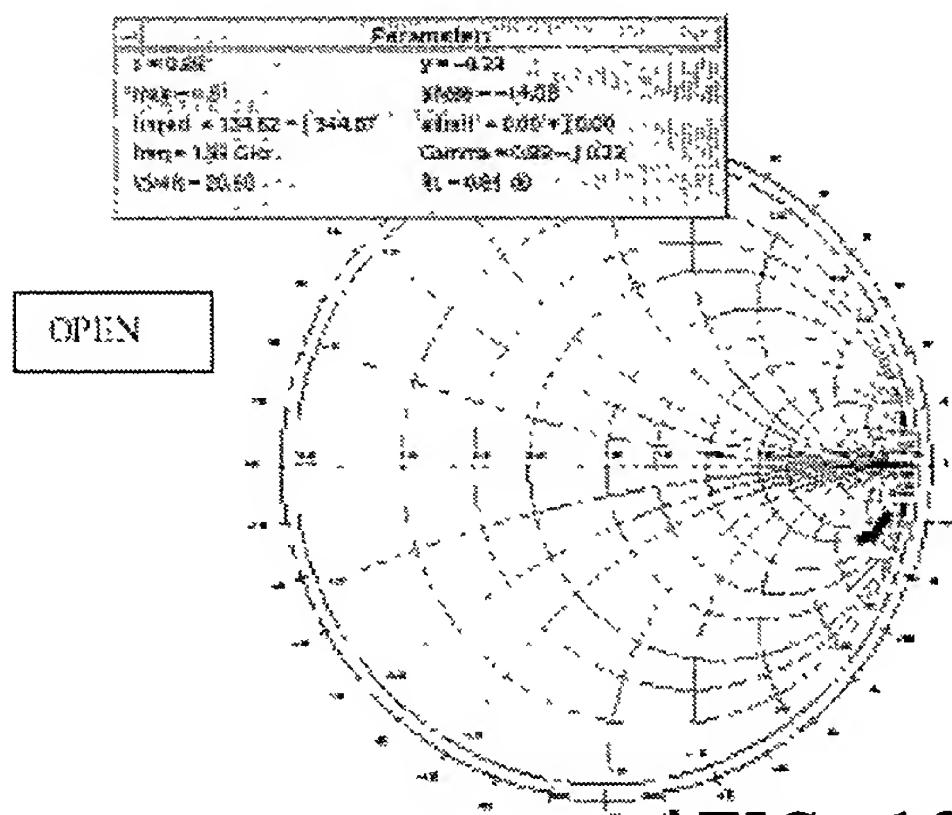


FIG. 10

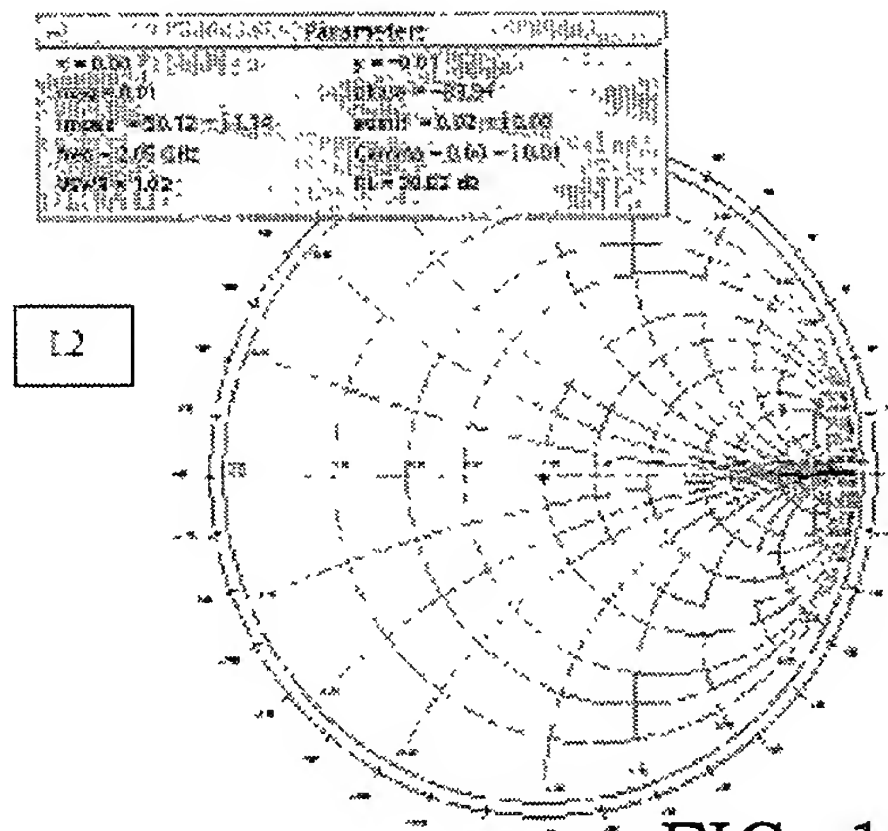


FIG. 13

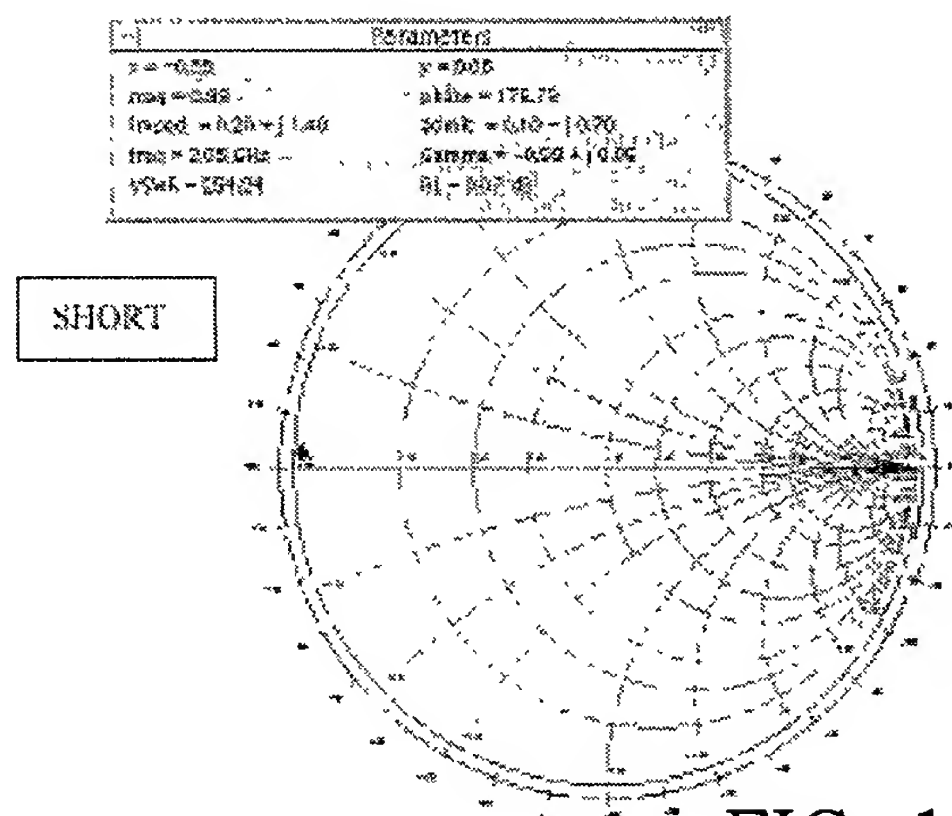


FIG. 11

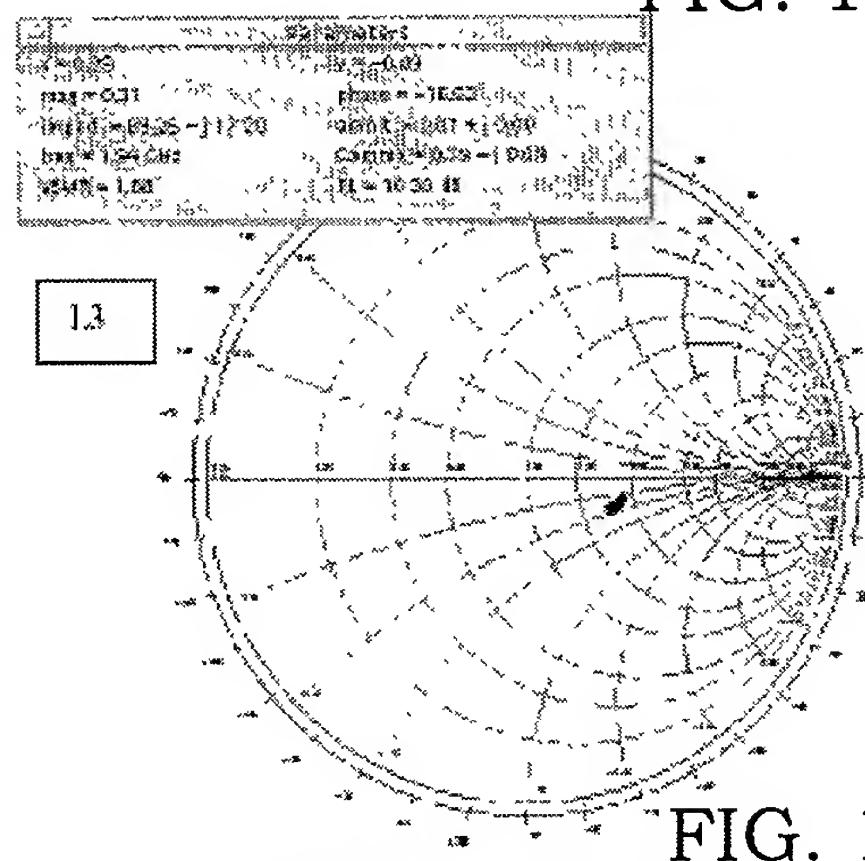


FIG. 14

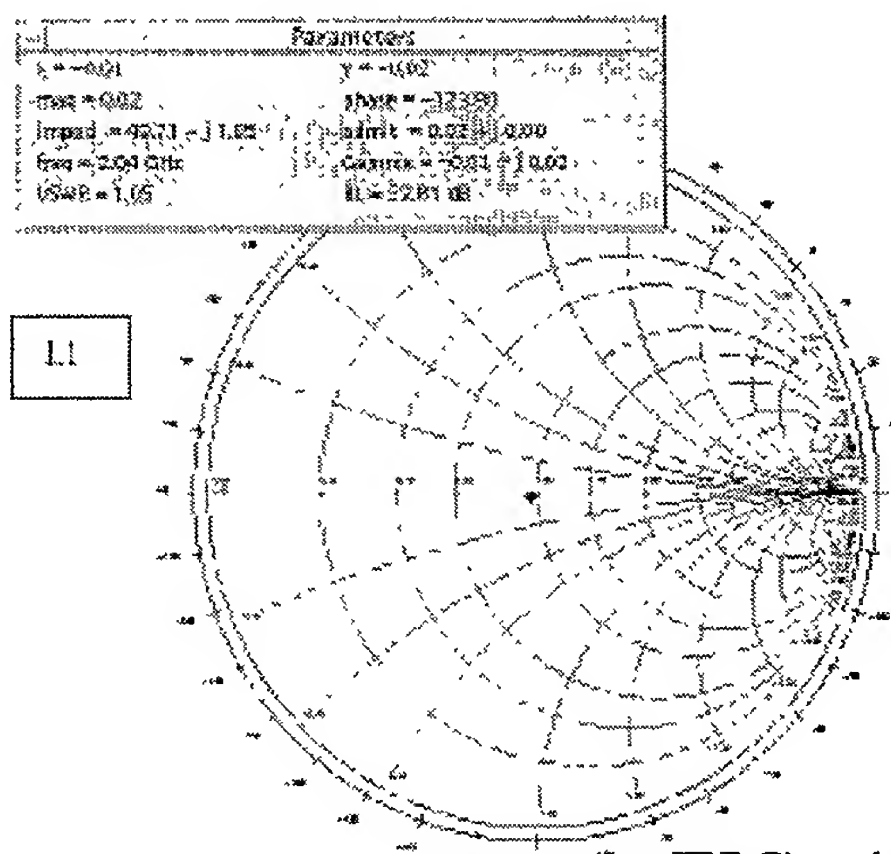


FIG. 12

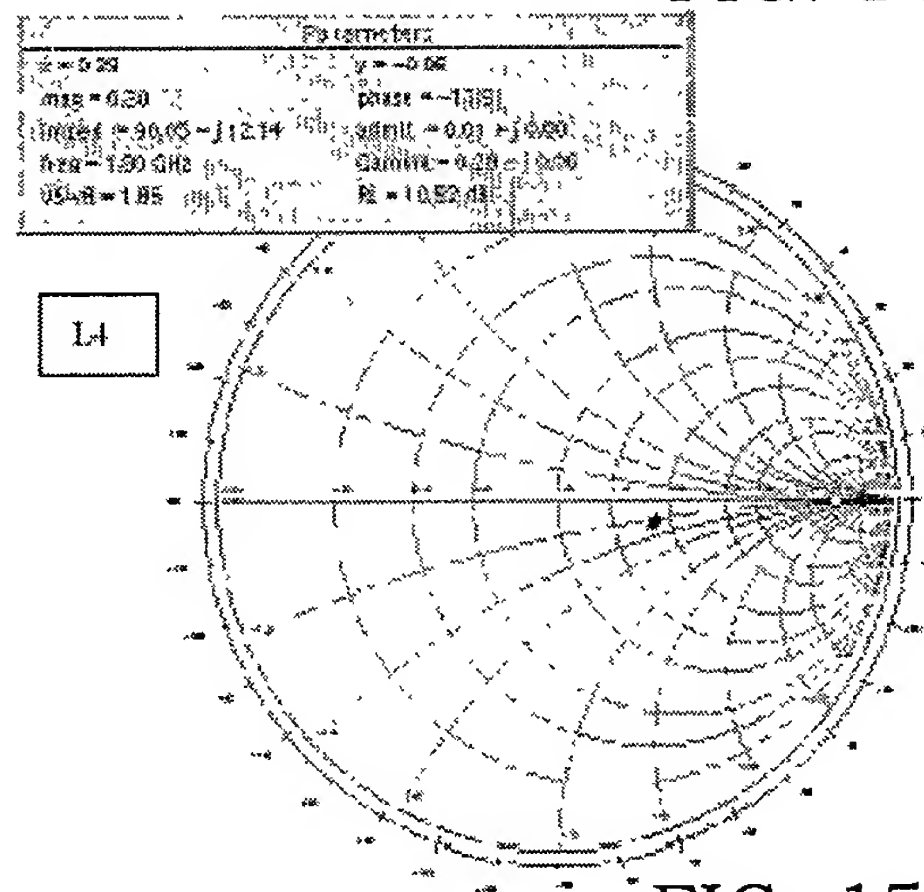


FIG. 15

10033412601

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
 ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

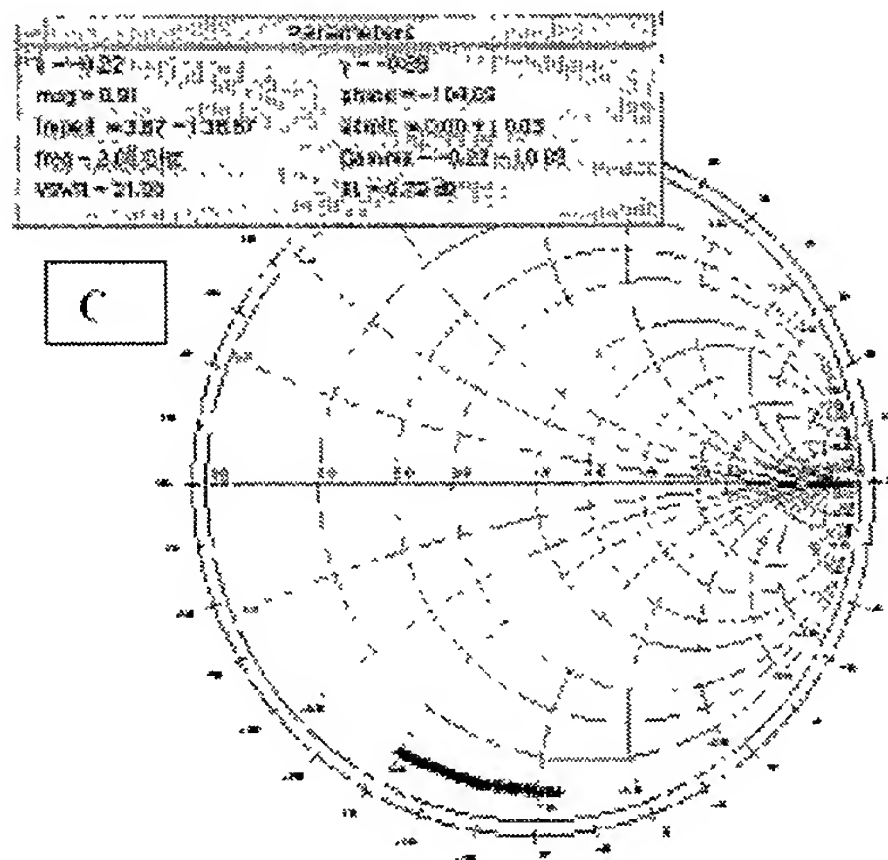


FIG. 16

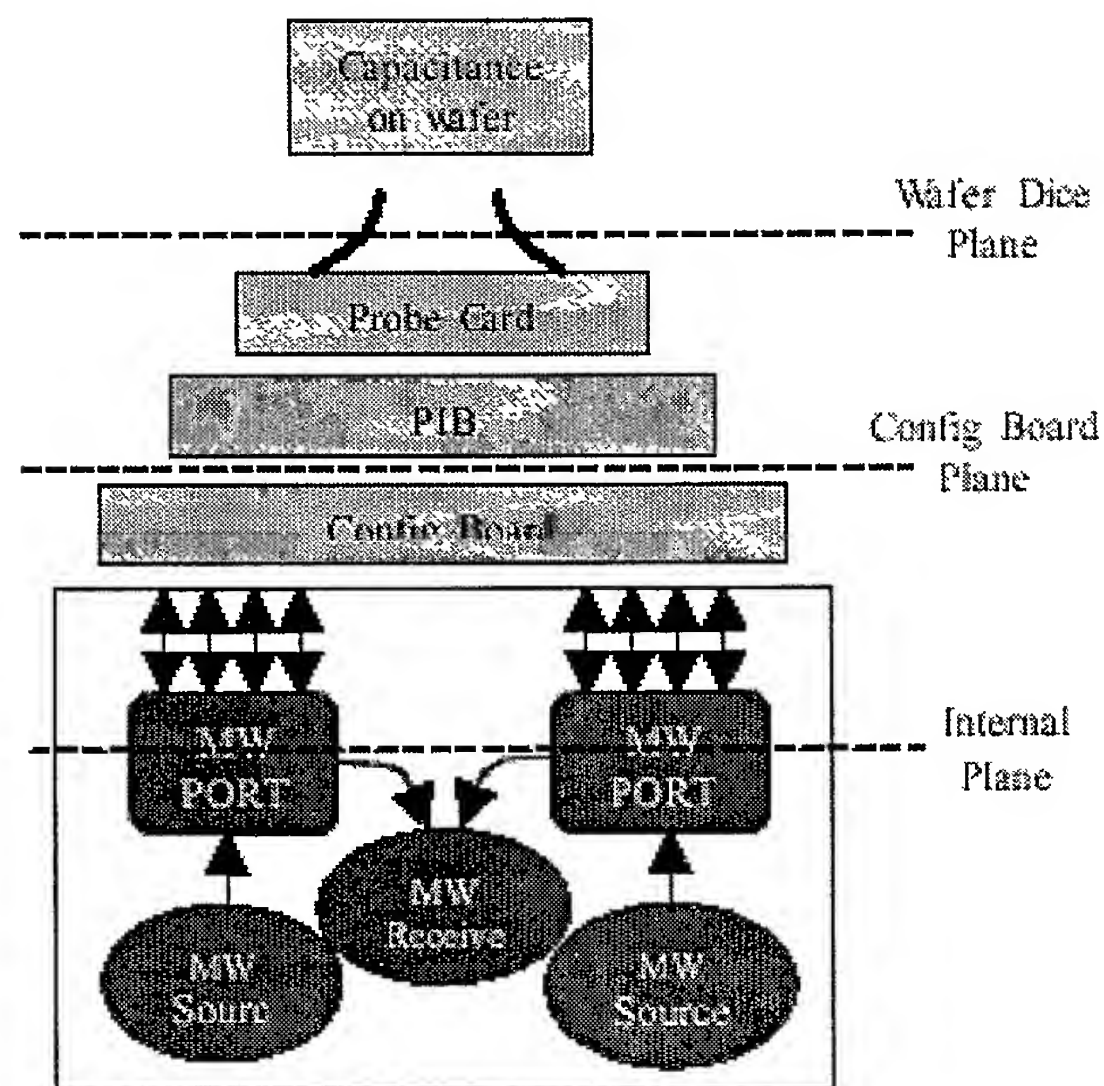


FIG. 17

10033364-122601

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678



Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678



1. 姓名	姓名
2. 性别	性别
3. 年龄	年龄
4. 职业	职业
5. 学历	学历
6. 婚姻状况	婚姻状况
7. 健康状况	健康状况
8. 兴趣爱好	兴趣爱好
9. 宗教信仰	宗教信仰
10. 政治倾向	政治倾向
11. 社会评价	社会评价
12. 自我评价	自我评价
13. 其他信息	其他信息
14. 备注	备注
15. 日期	日期
16. 地点	地点
17. 调查人	调查人
18. 审核人	审核人
19. 批准人	批准人
20. 备注	备注
21. 日期	日期
22. 地点	地点
23. 调查人	调查人
24. 审核人	审核人
25. 批准人	批准人
26. 备注	备注
27. 日期	日期
28. 地点	地点
29. 调查人	调查人
30. 审核人	审核人
31. 批准人	批准人
32. 备注	备注
33. 日期	日期
34. 地点	地点
35. 调查人	调查人
36. 审核人	审核人
37. 批准人	批准人
38. 备注	备注
39. 日期	日期
40. 地点	地点
41. 调查人	调查人
42. 审核人	审核人
43. 批准人	批准人
44. 备注	备注
45. 日期	日期
46. 地点	地点
47. 调查人	调查人
48. 审核人	审核人
49. 批准人	批准人
50. 备注	备注
51. 日期	日期
52. 地点	地点
53. 调查人	调查人
54. 审核人	审核人
55. 批准人	批准人
56. 备注	备注
57. 日期	日期
58. 地点	地点
59. 调查人	调查人
60. 审核人	审核人
61. 批准人	批准人
62. 备注	备注
63. 日期	日期
64. 地点	地点
65. 调查人	调查人
66. 审核人	审核人
67. 批准人	批准人
68. 备注	备注
69. 日期	日期
70. 地点	地点
71. 调查人	调查人
72. 审核人	审核人
73. 批准人	批准人
74. 备注	备注
75. 日期	日期
76. 地点	地点
77. 调查人	调查人
78. 审核人	审核人
79. 批准人	批准人
80. 备注	备注
81. 日期	日期
82. 地点	地点
83. 调查人	调查人
84. 审核人	审核人
85. 批准人	批准人
86. 备注	备注
87. 日期	日期
88. 地点	地点
89. 调查人	调查人
90. 审核人	审核人
91. 批准人	批准人
92. 备注	备注
93. 日期	日期
94. 地点	地点
95. 调查人	调查人
96. 审核人	审核人
97. 批准人	批准人
98. 备注	备注
99. 日期	日期
100. 地点	地点
101. 调查人	调查人
102. 审核人	审核人
103. 批准人	批准人
104. 备注	备注
105. 日期	日期
106. 地点	地点
107. 调查人	调查人
108. 审核人	审核人
109. 批准人	批准人
110. 备注	备注
111. 日期	日期
112. 地点	地点
113. 调查人	调查人
114. 审核人	审核人
115. 批准人	批准人
116. 备注	备注
117. 日期	日期
118. 地点	地点
119. 调查人	调查人
120. 审核人	审核人
121. 批准人	批准人
122. 备注	备注
123. 日期	日期
124. 地点	地点
125. 调查人	调查人
126. 审核人	审核人
127. 批准人	批准人
128. 备注	备注
129. 日期	日期
130. 地点	地点
131. 调查人	调查人
132. 审核人	审核人
133. 批准人	批准人
134. 备注	备注
135. 日期	日期
136. 地点	地点
137. 调查人	调查人
138. 审核人	审核人
139. 批准人	批准人
140. 备注	备注
141. 日期	日期
142. 地点	地点
143. 调查人	调查人
144. 审核人	审核人
145. 批准人	批准人
146. 备注	备注
147. 日期	日期
148. 地点	地点
149. 调查人	调查人
150. 审核人	审核人
151. 批准人	批准人
152. 备注	备注
153. 日期	日期
154. 地点	地点
155. 调查人	调查人
156. 审核人	审核人
157. 批准人	批准人
158. 备注	备注
159. 日期	日期
160. 地点	地点
161. 调查人	调查人
162. 审核人	审核人
163. 批准人	批准人
164. 备注	备注
165. 日期	日期
166. 地点	地点
167. 调查人	调查人
168. 审核人	审核人
169. 批准人	批准人
170. 备注	备注
171. 日期	日期
172. 地点	地点
173. 调查人	调查人
174. 审核人	审核人
175. 批准人	批准人
176. 备注	备注
177. 日期	日期
178. 地点	地点
179. 调查人	调查人
180. 审核人	审核人
181. 批准人	批准人
182. 备注	备注
183. 日期	日期

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

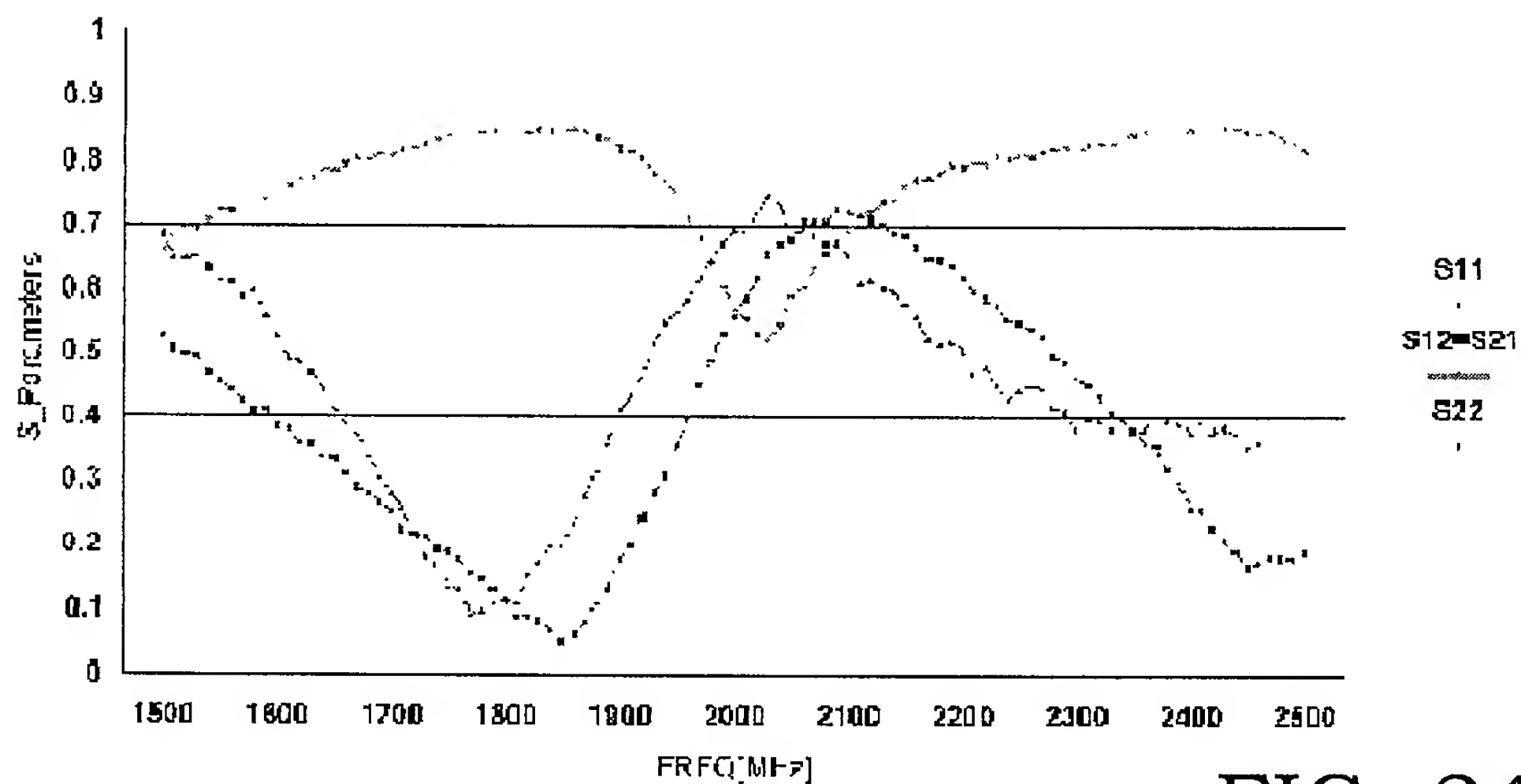


FIG. 24

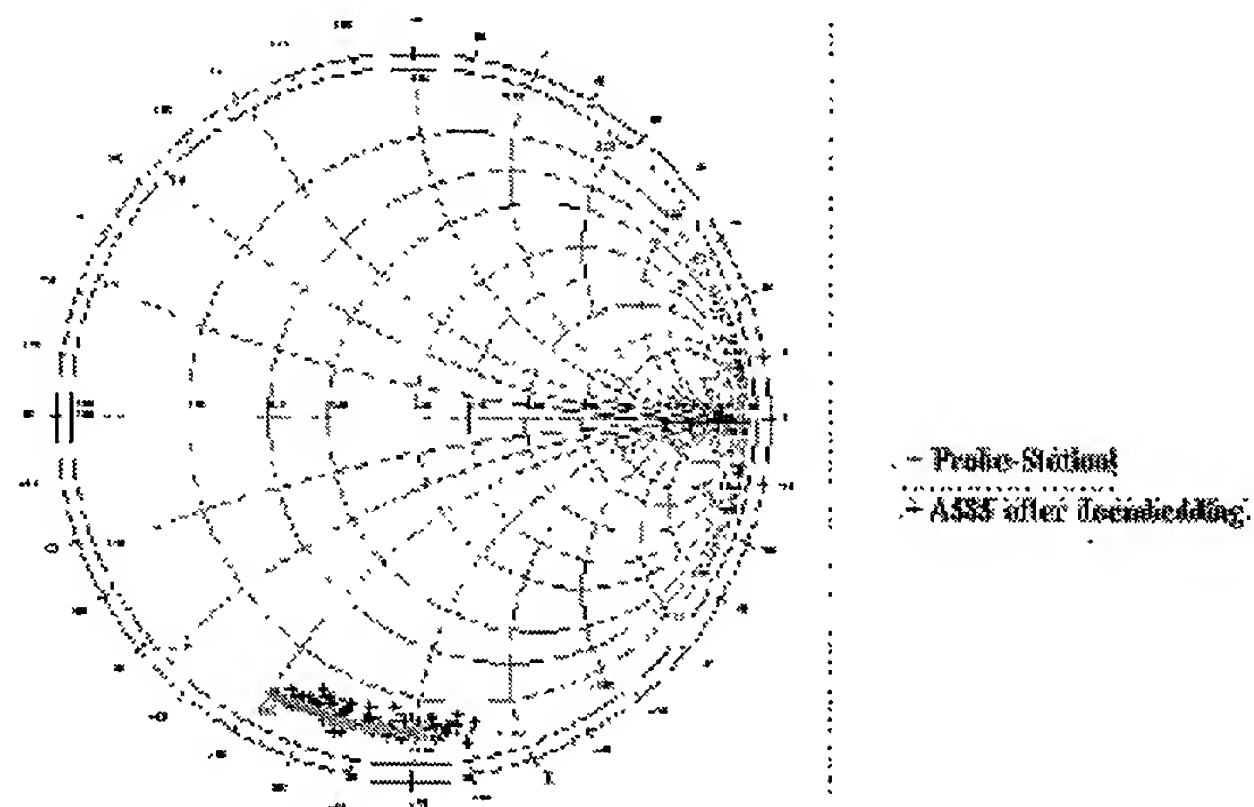


FIG. 25

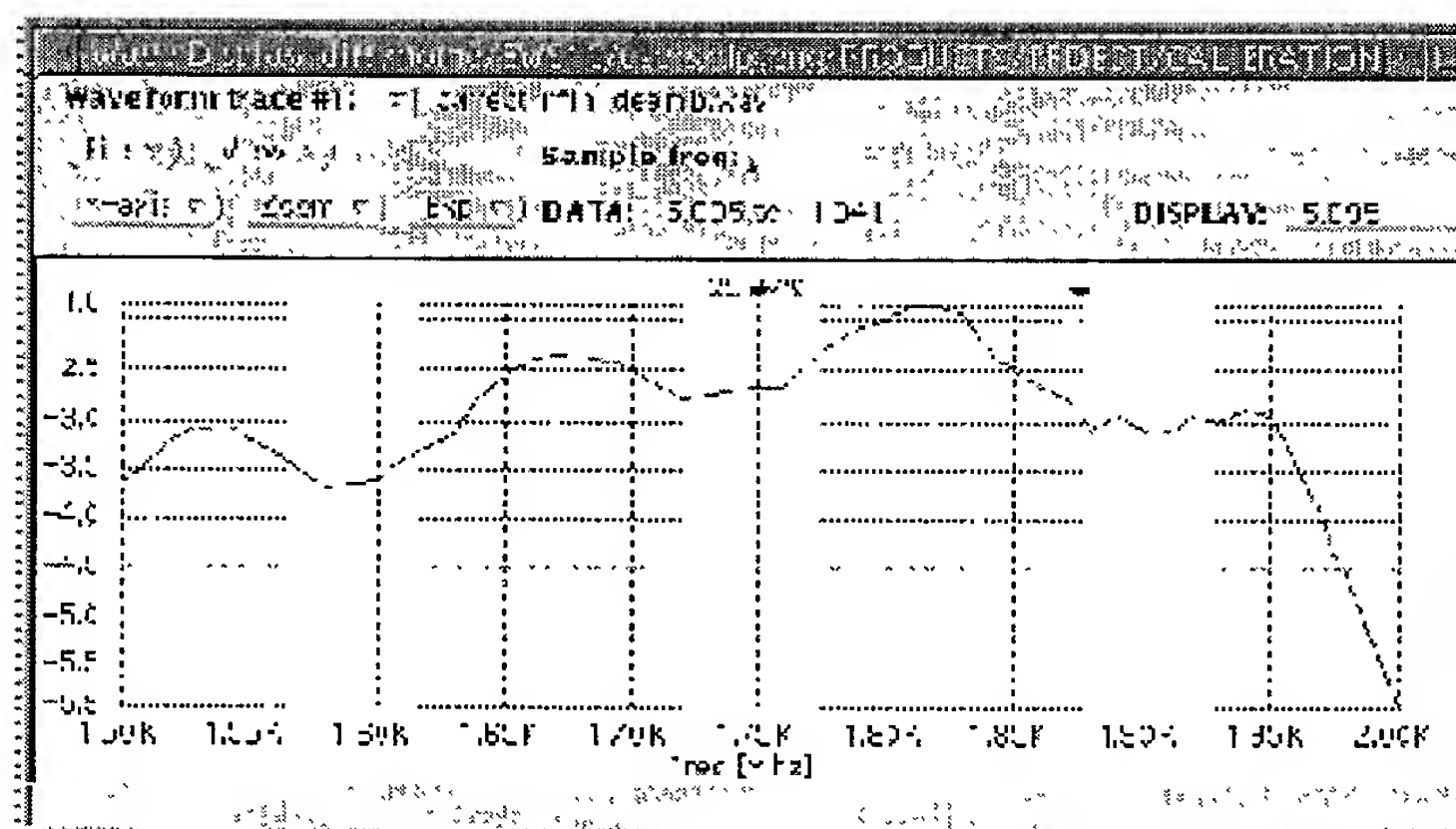


FIG. 26

Title: TEST BOARD DE-EMBEDDING METHOD TO IMPROVE RF MEASUREMENTS
ACCURACY ON AN AUTOMATIC TESTING EQUIPMENT FOR IC WAFERS

Inventors: Giuseppe Di Gregorio et al. Express Mail No.: EL755716868US Docket No.: 856063.678

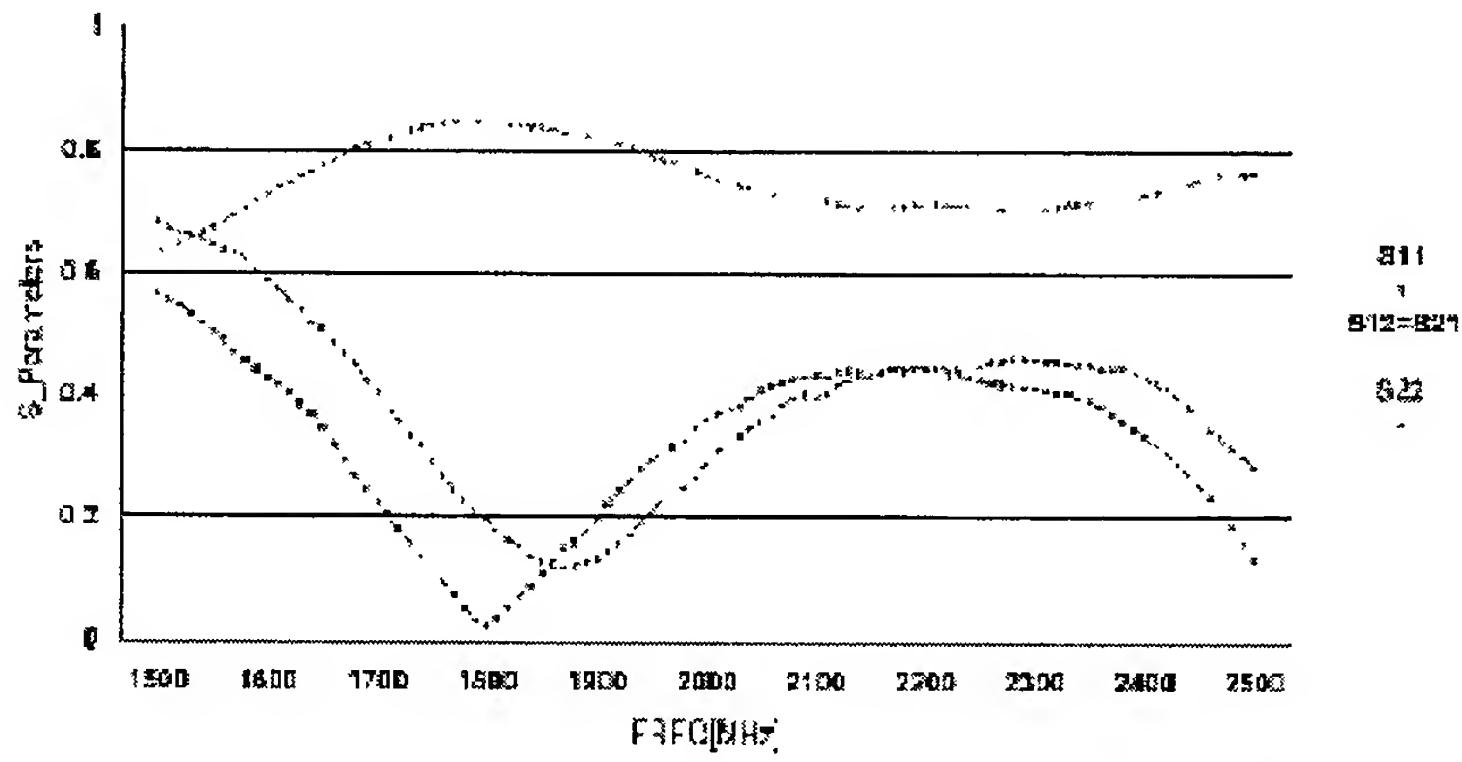


FIG. 27

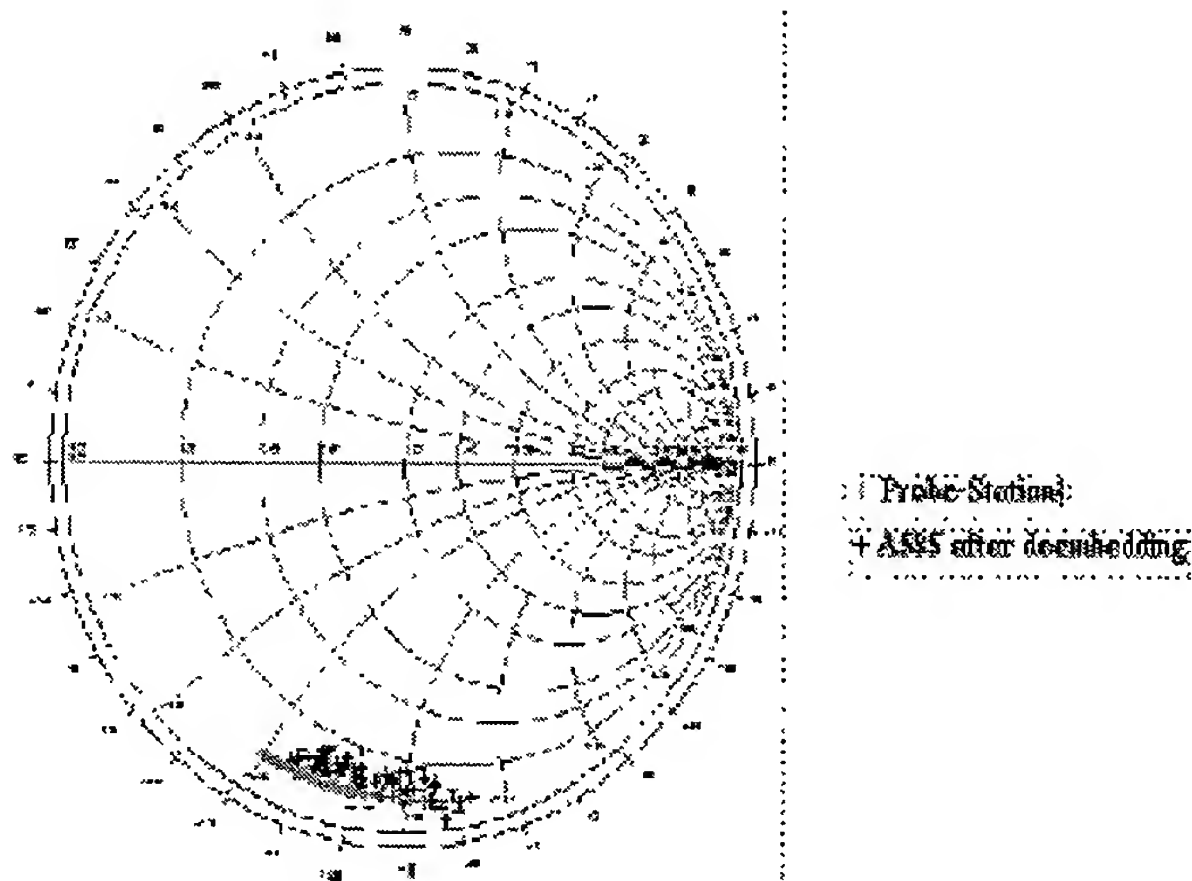


FIG. 28

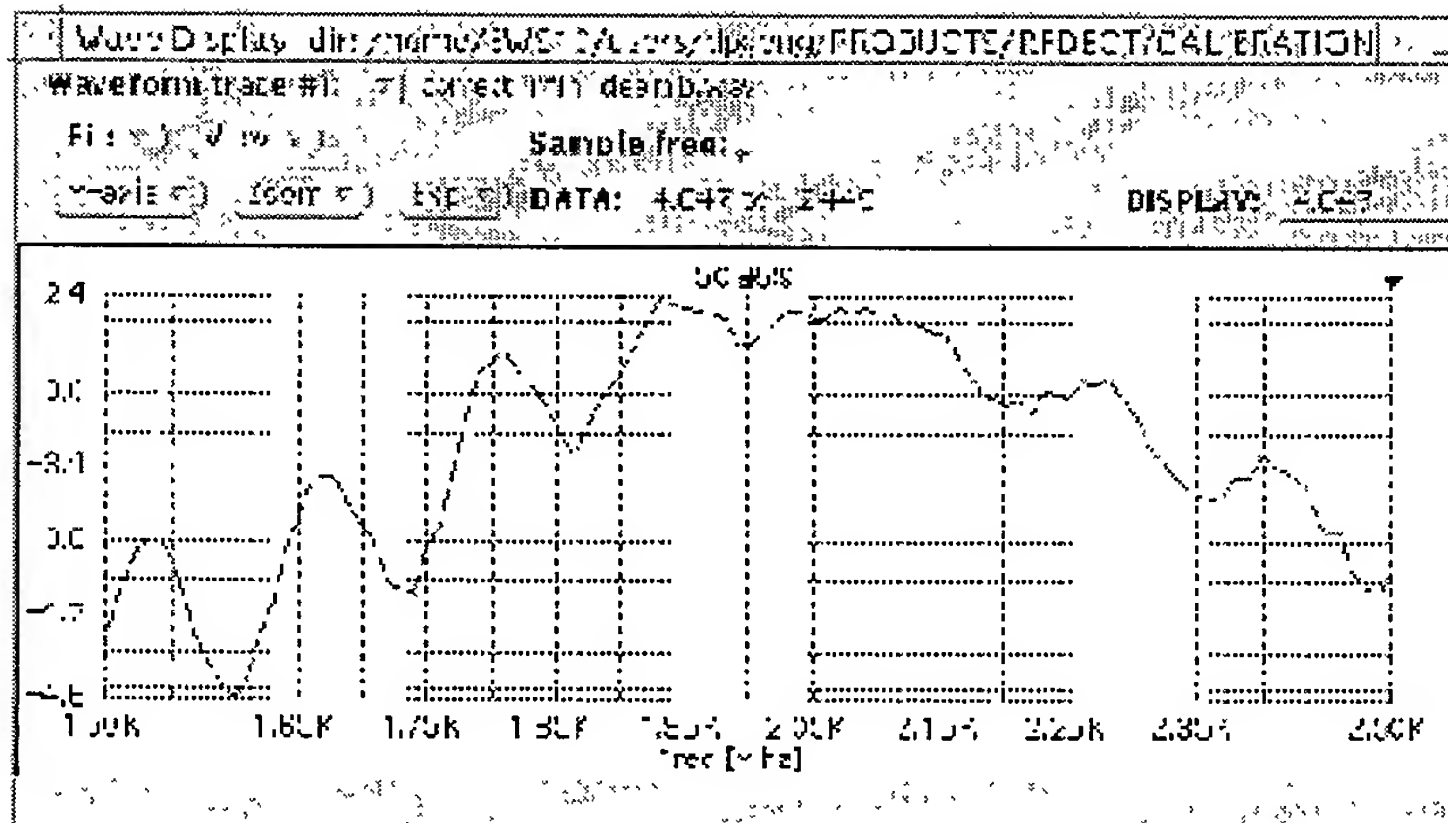


FIG. 29